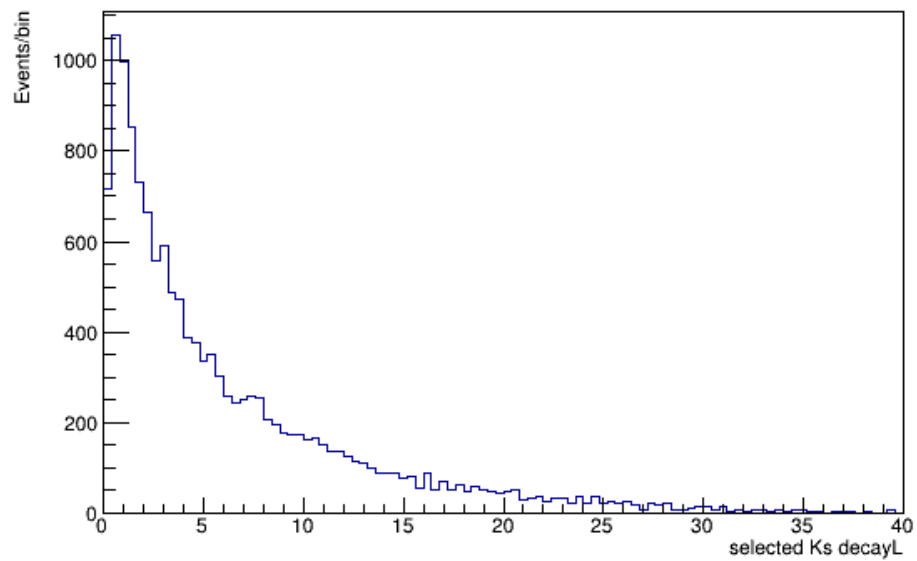
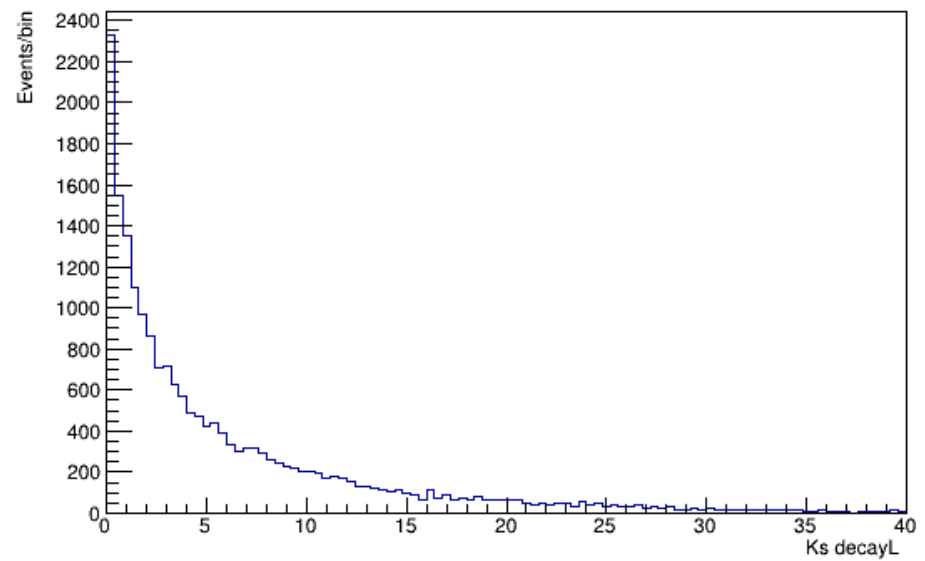


$K_s \text{ eff}$

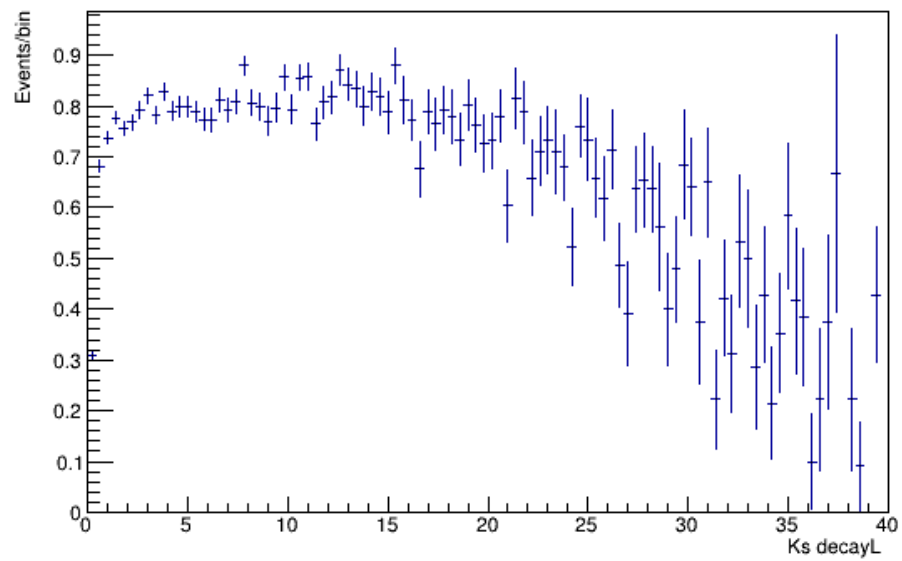
selected_decayL



truth_decayL



Eff



编号	带电径迹数	原因	事例数	占比
0	---	正确重建（如有多个候选，保留最接近中心质量事例）	14094	70%
1	---	带电径迹小于两条	3040	15%
2	2	两条相同电荷径迹	153	1%
3	2	$\text{abs}(m_{Ks}-0.0.497611)>0.2$	112	1%
4	2	第一次拟合失败	248	1%
5	2	第二次拟合失败	172	1%
6	2	$\text{chi}^2>200$	123	1%
7	2	$\text{decayL}/\text{err}\leq 2$	1573	8%
8	2	$\text{fabs}(\text{costheta}) \geq 0.93$	180	1%
9	2	$(*\text{itTrk})\rightarrow\text{isMdcKalTrackValid}()$	8	0%
10	>2	有多种失败组合	297	1%
		合计	20000	100%